

# γ 譜法分析鈾、鑷、釔含量的研究

夏 明

鈾、鑷、釔在岩石、矿物和各种地質建造中的丰度的測定和分布規律的研究是元素地球化学課題之一，是鈾、鑷、釔地球化学的主要內容，是研究放射性元素矿床的成因及其分布規律的基础，是測定地質建造絕對年龄的組成部分，是探討天然核轉变及其生成热在地質历史中作用的对象之一。

放射性元素的物理測量是建立在核衰变过程中某些特殊属性的基础之上的。总括起来，可以归結为：(1)利用各种射綫的放射性总強度；(2)采用某一种射綫不同能量区間的強度；(3)前两种类型的相互配合。根据測量对象的特点和要求，随着現代技术的进展，目前，放射性物理測量已发展为数种方法。 $\gamma$  譜法就是应用閃爍技术的方法之一。

$\gamma$  譜法是利用鈾、鑷、釔  $\gamma$  射綫強度在不同能量区間的差异，通过閃爍譜仪的微分或积分測量，并与标准相比，确定相应元素含量的一种方法。

自 1956 年以来，各國学者相繼完成了各种各样的測量鈾、釔元素的  $\gamma$  譜法（見表 1）。

就表 1 列舉的鈾、鑷、釔的測定而言，可以分为下列两种情况：

(1) 鈾鑷平衡， $K^{40}$  的影响不大，样品中主要放射体是鈾(或鑷)和釔。在这种情况下，仅需要两个独立的方程式即可确定鈾和釔的含量。假若釔系平衡遭到严重的破坏，只需 50 年就能恢复，故自然界中的釔系通常是处于平衡状态的。

(2) 鈾鑷不平衡， $K^{40}$  的含量可以忽略不計，則鈾、鑷、釔可做为三組分的样品。为此，需要三个相应的方程式才能測出其含量。自然界中，由于氡的迁移；母体和子体达成平衡的地質年代不够；母体或子体的部分淋滤和局部集聚以及矿床表生带的某些地球化学作用，鈾、鑷之間的平衡常常遭到不同程度的破坏。平衡系数在 1—1000% 范围之内变化。因此，分別測定鈾、鑷和釔的含量是十分必要的。

就  $\gamma$  譜的測量方法而言，可分別測定鈾、鑷、釔、鉀。其灵敏度根据样品重量不同(20—200 克) 可达  $10^{-3}$ — $10^{-6}$  克/克。精确度在  $\pm 10\%$  以内。能量区間的选择有多种途径：用 0—400 千电子伏低能范围的鈾、鑷、釔微分計數<sup>[2,3,5,6]</sup>；用高、低能的鈾、鑷、釔微分和积分計數<sup>[4,6]</sup>等等。此外，还有与其它种类射綫組合的綜合方法，例如： $\beta-\gamma$  法<sup>[7]</sup>、 $\beta-\gamma-\gamma$  法<sup>[8-11]</sup>、 $\alpha-\beta-\gamma-\gamma$  法<sup>[12]</sup>。

$\beta-\gamma$  法只适用于測量鈾鑷平衡的含釔矿样（第一种情况）。运用  $\alpha$ 、 $\beta$  测量时，物质成分、样品厚度和自吸收、几何条件等因素影响甚大。同时，分析程序也較为复杂。运用  $\gamma$  譜測量，不仅可以排出和減弱这些影响，而且能簡化分析过程，提高工作效率。因此，本文在分析鈾、鑷、釔含量时，采用了  $\gamma$  譜方法。

$\gamma$  譜仪的性能及其选用条件是測試工作的先决条件，是提高灵敏度和精确度的重要措施之一。但已有的文献中，大部分沒有做过任何論述，只有文献[1]做了点滴的說明。因此，本文的重点是討論能譜仪的性能对測量  $\gamma$  譜的影响和最佳条件的选择。

表1 用于铂、钯、钍测量的 $\gamma$ 谱法一览表

| 作<br>年<br>代   | 分析元素及测量条件   |   |  | 样品重量<br>测量时间   | 方法的灵敏度  | 相对误差及本底  | 仪器设备及性能  | 文献<br>来源  | 备注  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|-----|
|   | U-Ra  | Tb  | K  |  |   |  |  |   |     |
| 赫里(P. M. Hurley) 1956                                 | U-Ra 平衡<br>(Ra <sup>226</sup> ):<br>188 千电子伏<br>道宽 25 千电子伏  | (Pb <sup>214</sup> )<br>238 千电子伏<br>道宽 25 千电子伏  | (K <sup>40</sup> )<br>1.46 光<br>子伏<br>道宽 134<br>千电子伏   | $C_U = 30.5$ 毫克/<br>计数/分<br>$C_Tb = 91$ 毫克/<br>计数/分<br>$\frac{Q_U}{Q_Tb} = 2.4$  | 0.5 克<br>20 分   | $U > 0.01\%$<br>$Tb > 0.01\%$<br>相当量   | $U: 2-7\%$<br>$Tb: 2-8\%$<br>本底 9 计数/分   | 双道-多道闪烁能谱仪,<br>凹型晶体, NaI(Tl),<br>1 1/4×2 时, 5819 型光电<br>倍加管, 直径 15<br>毫米, 中心称样孔直经 3 毫<br>米, 高 38.1 毫米                               | [1] |
| 约赫尔逊<br>(C. B. Иохельсон)<br>希拉夫(E. B. Шилов) 1957    | U(Th <sup>232</sup> ):<br>93 千电子伏<br>Ra(Th <sup>232</sup> ):<br>350 千电子伏<br>B. Шилов) 1957  | (Pb <sup>214</sup> )<br>238 千电子伏  | (K <sup>40</sup> )<br>75 千电子伏<br>道宽<br>$C_{Th}/C_{K^{40}}$   | $\frac{a_{11}}{a_{11} + a_{12} + a_{13}} =$<br>56%<br>$\frac{a_{22}}{a_{21} + a_{22} + a_{23}} =$<br>66.9%<br>$\frac{a_{33}}{a_{21} + a_{22} + a_{23}} =$<br>50.6% | 100 克<br>100 秒<br>100 秒<br>10—20 秒  | $U: 0.01\%$<br>$Ra: 2 \times 10^{-11}$<br>克/克<br>Ra: 0.33%<br>Th: 0.33%  | $U, Ra, Tb:$<br>8—12%<br>(最大 20%)  | 多道微分能谱仪, 示波<br>照像, NaI(Tl)晶体, 32×<br>16 毫米, 光电倍加管 Φ3Υ-<br>19, 照像器 M-2, 镜宽<br>0.05 毫米, 能量分辨率<br>—14%，能量分辨率<br>—1.5—2 小时内稳定性 5—<br>7% | [2] |
| 迈罗(J. L. Mero) 1960                                   | U-Ra:<br>190 千电子伏,<br>240 千电子伏<br>C <sub>190</sub> /C <sub>240</sub><br>Ra:<br>350 千电子伏<br>C <sub>350</sub> /C <sub>240</sub>                   | (Pb <sup>214</sup> )<br>75 千电子伏<br>道宽<br>$C_{190}/C_{350}$  | (K <sup>40</sup> )<br>0.042 计数/<br>分/1% U <sub>238</sub><br>K <sub>350</sub> = 0.046 计数/<br>分/1% ThO <sub>2</sub>  | 20 克   | $U_2 O_8 > 6.1\%$<br>ThO <sub>2</sub> > 0.1%  | —  | γ 闪烁能谱仪, 晶体<br>NaI(Tl) 1 1/2×1 时, 光<br>电倍加管 Do-Mont 6292<br>钢盘直径为 5 厘米                                   | [3]   |     |
| 朗兹(P. W. de Lange) 1960                               | U+Ra+Th:<br>140 或 100 千电子伏的积分<br>计数( $r'$ )<br>Ra+Th:<br>2.62 兆电子伏以上的微分计<br>数( $r''$ )<br>U+Ra+Th:<br>89 千电子伏的微分计数总数<br>( $r^0$ )<br>道宽 55 千电子伏 | (K <sup>40</sup> )<br>240 千电子伏<br>道宽 10 千电子伏<br>Ra(Pb <sup>214</sup> ):<br>350 千电子伏<br>道宽 50 千电子伏 | $r'_U = 7.59 \times 10^8$<br>$r'_Ra = 1.878 \times 10^4$<br>$r'_Tb = 8.28 \times 10^8$<br>$r''Ra = 9.4$<br>$r''Tb = 89.6$<br>$r^0_U = 1.038 \times 10^8$<br>$r^0_{Ra} = 4.409 \times 10^8$<br>$r^0_Tb = 2.276 \times 10^8$ | 18 克<br>(重量校正)   | $U, Ra, Tb:$<br>0.1—0.01%<br>$r' = 500$ 计数/分<br>$r'' = 2.7$ 计数/分<br>$r^0 = 85$ 计数/分   | $U: 0.1-7\%$   | γ 闪烁仪器, NaI(Tl)<br>晶体, 1 1/4×2 时, 665 型<br>光电子倍加管, 稳定良好<br>(对电子不大于 2.6 毫米<br>在星期天不大于 0.5%)<br>室温为 21±5°C | [4]   |     |
| 亚库勃维奇<br>(А. Л. Якубович)<br>札伊切夫<br>(И. Зайчев) 1961 | U(Th <sup>232</sup> ):<br>100 千电子伏,<br>道宽 10 千电子伏<br>Ra(Pb <sup>214</sup> ):<br>350 千电子伏<br>道宽 40<br>千电子伏                                       | (Pb <sup>214</sup> ):<br>240 千电子伏<br>道宽 100<br>千电子伏<br>道宽 40<br>千电子伏                              | $A_1^U = 0.41$<br>$A_3^Ra = 0.98$<br>$A_2^{Th} = 0.83$<br>$A_4^K = 7.7 \times 10^{-4}$   | 180 克<br>30 分  | $U, Ra, Tb, K:$<br>$n \times 10^{-4}\%$<br>$Ra: \pm 1 \times 10^{-4}\%$<br>$Tb: \pm 1 \times 10^{-4}\%$<br>$n \times 10^{-4}\%$<br>$K: \pm 0.5\%$<br>$U: \pm 1-2 \times 10^{-4}\%$<br>本底 = 13 计数/分<br>$Ra: \pm 1 \times 10^{-4}\%$<br>本底 = 28 计数/分<br>$Tb: \pm 1 \times 10^{-4}\%$<br>本底 = 25 计数/分<br>$K: \pm 0.5\%$<br>本底 = 9 计数/分 | $U: \pm 1-2 \times 10^{-4}\%$<br>本底 = 13 计数/分<br>$Ra: \pm 1 \times 10^{-4}\%$<br>本底 = 28 计数/分<br>$Tb: \pm 1 \times 10^{-4}\%$<br>本底 = 25 计数/分<br>$K: \pm 0.5\%$<br>本底 = 9 计数/分 | 作者做了 $\beta$ - $\gamma$ ,<br>$\gamma$ - $\gamma$ , $B$ - $T$ - $T$ 法<br>及化学分析数据的对比得<br>出结果很好             | [5]   |     |

## 二、

鈾、鐳、鈈  $\gamma$  譜的強度差異是測量工作的物理基礎。

鈾和鈈經過一系列衰變之後，最終轉為鉛的穩定同位素。在鈾、鈈系中， $\alpha$ 、 $\beta$  衰變經常伴隨着放出  $\gamma$  射線。鈾組、鐳組和鈈系的  $\gamma$  射線能量有明顯的差異（見表 2）。

從表 2 列舉的鈾組、鐳組和鈈系的  $\gamma$  放射體來看，其能量變化極大，由 0.007 兆電子伏到 2.62 兆電子伏。在這樣大的能量範圍內，作為選擇鈾、鐳、鈈能量區間的主要條件是：

(1) 譜線相對強度（每個衰變相應的  $\gamma$  量子數或比值）和譜線的微分強度（某一能量區間的總強度）。晶體閃爍探測器所測得的鈾、鐳、鈈的  $\gamma$  射線強度，其 80—90% 是集中於 0—400 千電子伏之內的。

(2) 在所選用能量區間內，各元素的  $\gamma$  貢獻應有所區別。欲測元素的貢獻應最大，即有較高的分辨系數。

我們用 SGXA-2 型單道閃爍能譜儀分別記錄了鈾、鈾-鐳平衡和鈈的  $\gamma$  譜（見圖 1）。60—

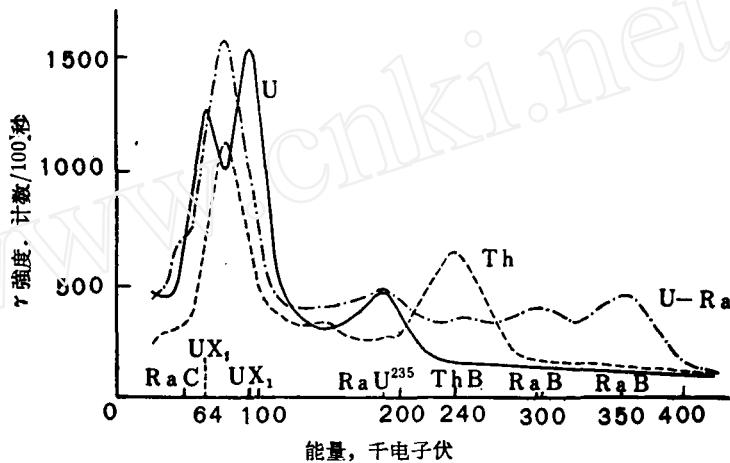


圖 1 鈾、鈾-鐳平衡和鈈的  $\gamma$  譜  
道寬 16 千電子伏。

90 千電子伏的  $\gamma$  譜較為複雜。鈦組的  $UX_1$  ( $E = 64$  和  $E = 93$  千電子伏)，鐳組的內轉換電子 ( $E_\gamma = 75$  千電子伏)<sup>1)</sup> 以及鈈系的內轉換電子 ( $E_\gamma = 75$  千電子伏)<sup>2)</sup> 組成這個能峯。 $UX_1$  (93 千電子伏) 峰是鈦組中微分強度最大的峯。雖然鐳和鈈峯值也較大，但選用最佳的測量條件和控制儀器的穩定狀態，可以得到較好的分辨系數。240 千電子伏的  $\gamma$  峰是鈈  $ThB$  ( $E = 238$  千電子伏) 引起的。在這個能量區間內，沒有鈾、鐳的特徵譜線。350 千電子伏的峯幾乎完全是由鐳  $RaB$  ( $E = 350$  千電子伏) 所引起的。

根據上述各種因素的分析和實驗結果，鈾、鐳和鈈的  $\gamma$  射線能量可分別採用 93 千電子伏，350 千電子伏和 238 千電子伏。

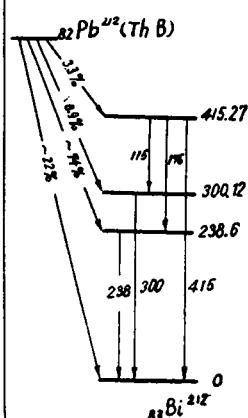
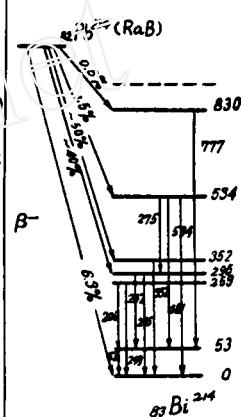
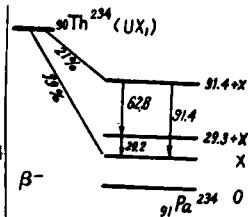
$\gamma$  閃爍譜儀測量低能  $\gamma$  射線是通過  $\gamma$  射線與晶體作用所產生的各種效應：光電效應、多次散射、康普頓效應、反散射和邊界效應。其中，光電效應是測量的基礎。根據峯出現的位置確定  $\gamma$  射線的能量，用峯的面積推算出  $\gamma$  射線強度。

1) B. H. 蘭佐諾夫<sup>[18]</sup>認為該峯值是由  $RaB$  ( $E = 74.9$  千電子伏)， $RaC$  ( $E = 77.1$  千電子伏) 和  $Ra$  ( $E = 88.4$  千電子伏) 引起的。

2)  $RaTh$  ( $E = 88.4$  千電子伏) 的貢獻不大<sup>[18]</sup>。

表2 铀镭平衡系和钍系的 $\gamma$ 放射性同位素

| 核的名称              | 衰变种类                      | 原子核                  | 半衰期                     | $\gamma$ 射线  |   |   | 衰变图 |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|---|-----|
|                   |                           |                      |                         | 能量, 光电子伏   | 衰变的百分比                                      | 每个衰变中 $\gamma$ 强度比                            |     |
| <b>铀-镭系</b>       |                           |                      |                         |  |   |   |     |
| U I               | $\alpha, \gamma$          | $^{238}_{\text{U}}$  | $4.5 \times 10^9$ 年     | 0.048  | 22%   |   |     |
| UX <sub>1</sub>   | $\beta^-, \gamma$         | $^{234}_{\text{Th}}$ | 24.1 天                  | $\gamma_1 = 0.029, \gamma_2 = 0.064, \gamma_3 = 0.093$   | $\gamma_1: 79\%, \gamma_2 + \gamma_3: 21\%$ | $\gamma_1: \gamma_2: \gamma_3 = 1:2:2.8$      |     |
| UX <sub>2</sub>   | $\beta^-, \gamma$         | $^{234}_{\text{Pa}}$ | 1.18 分                  | 0.394, 0.782, 0.806, 0.820   |   |   |     |
| U II              | $\alpha, \gamma$          | $^{234}_{\text{U}}$  | $2.6 \times 10^8$ 年     | 0.053, 0.093, 0.118  |   | 1:~0.2:0.4                                    |     |
| Po                | $\alpha, \gamma$          | $^{230}_{\text{Th}}$ | $8.3 \times 10^4$ 年     | 0.068 (0.150, 0.210, 0.254)  | 28% (<3%)                                   |   |     |
| <b>镭组</b>         |                           |                      |                         |  |   |   |     |
| Ra                | $\alpha, \gamma$          | $^{228}_{\text{Ra}}$ | 1590 年                  | 0.188  | 5.7%  |   |     |
| Rn                | $\alpha$                  | $^{222}_{\text{Rn}}$ | 3.825 天                 |  |   |   |     |
| RaA               | $\alpha, \beta^-$         | $^{218}_{\text{Po}}$ | 3.05 分                  |  |   |   |     |
| RaB               | $\beta^-, \gamma$         | $^{214}_{\text{Pb}}$ | 28.8 分                  | $\gamma_1 = 0.053, \gamma_2 = 0.241, \gamma_3 = 0.259, \gamma_4 = 0.295, \gamma_5 = 0.350$                             | $\gamma_5: 50\%, \gamma_4: 40\%$            | $\gamma_2: \gamma_4: \gamma_5 = 0.2:0.55:1.0$ |     |
| RaC               | $\beta^-, \gamma$         | $^{214}_{\text{Bi}}$ | 19.7 分                  | (0.063) 0.609, 0.766, 0.933, 1.12, 1.238, 1.379, 1.520, 1.761, 1.820, 2.25, 2.42                                       |   | 0.1, 3:1.1: 0.9:0.7: 3.2:0.2:1: 0.5           |     |
| RaC'              | $\alpha$                  | $^{214}_{\text{Po}}$ | $1.64 \times 10^{-1}$ 秒 |  |   |   |     |
| RaD               | $\beta^-, \gamma$         | $^{210}_{\text{Pb}}$ | 22 年                    | 0.007, 0.023, 0.037, 0.043, 0.047, 0.065   |   |   |     |
| RaE               | $\beta^-$                 | $^{210}_{\text{Bi}}$ | 5 天                     |  |   |   |     |
| RaF               | $\alpha, \gamma$          | $^{210}_{\text{Po}}$ | 138.4 天                 | (0.084) 0.804  |   |   |     |
| RaG               |                           | $^{206}_{\text{Pb}}$ | 稳定                      |  |   |   |     |
| <b>钍系</b>         |                           |                      |                         |  |   |   |     |
| Th                | $\alpha, \gamma$          | $^{232}_{\text{Th}}$ | $1.4 \times 10^{10}$ 年  | 0.055 (0.075)  | 24%   |   |     |
| MtTh <sub>1</sub> | $\beta^-, \gamma$         | $^{228}_{\text{Ra}}$ | 6.7 年                   | 0.030  |   |   |     |
| MtTh <sub>2</sub> | $\beta^-, \gamma$         | $^{228}_{\text{Ac}}$ | 6.13 年                  | 0.060, 0.135, 0.184, 0.338, 0.462, 0.553, 0.590, 0.913, 0.969  |   |   |     |
| RdTh              | $\alpha, \gamma$          | $^{228}_{\text{Th}}$ | 1.9 年                   | 0.087  |   |   |     |
| ThX               | $\alpha, \gamma$          | $^{224}_{\text{Ra}}$ | 3.64 年                  | 0.241  |   |   |     |
| Tn                | $\alpha$                  | $^{220}_{\text{Rn}}$ | 54.5 秒                  |  |   |   |     |
| ThA               | $\alpha$                  | $^{216}_{\text{Po}}$ | 0.16 秒                  |  |   |   |     |
| ThB               | $\alpha$                  | $^{212}_{\text{Pb}}$ | 10.6 时                  | $\gamma_1 = 0.115, \gamma_2 = 0.176, \gamma_3 = 0.238, \gamma_4 = 0.249, \gamma_5 = 0.299$                             | $\gamma_5: 74\%$                            | $\gamma_3: \gamma_5 = 10:1$                   |     |
| ThC               | $\alpha, \beta^-, \gamma$ | $^{212}_{\text{Bi}}$ | 1.09 时                  | $\alpha = 0.04, 0.144, 0.164, 0.288, 0.328, 0.438, 0.452, 0.472$<br>$\beta = 0.72, 0.83, 1.03, 1.34, 1.61, 1.81, 2.20$ | $\sim 19\%, \sim 19\%, 6\%, 5\%, 7\%, 7\%$  |   |     |
| ThC'              | $\alpha$                  | $^{212}_{\text{Po}}$ | $0.3 \times 10^{-6}$ 秒  |  |   |   |     |
| ThC''             | $\beta^-, \gamma$         | $^{208}_{\text{Tl}}$ | 3.1 分                   | 0.277, 0.510, 0.582, 0.859, 2.62   | 10%, ~23%, 52%, 15%, 1.5%                   | 0.4:1:3.6: 0.68:4.5                           |     |
| ThD               |                           | $^{206}_{\text{Pb}}$ | 稳定                      |  |   |   |     |



$\gamma$  射线引起晶体发光，光电倍加管将这些光转化为电讯号。然后，通过放大器、甄别器记录一条按脉冲幅度分布的曲线。曲线的高度代表了 $\gamma$  射线的强度，也反应了欲测对象的含量。脉冲幅度取决于入射能量的大小。假若入射 $\gamma$  量子的能量是单一的( $E_1$ )，那么按脉冲幅度分布的曲线可用下列函数式表示：

$$g(E) = af(E, E_1), \quad (1)$$

式中： $a$  为元素的含量； $E$  为脉冲幅度，以甄别水平的能量刻度表示。

显而易见，当入射 $\gamma$  量子的能量为  $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$  时，则公式(1)为

$$g(E) = \sum_{i=1}^n a_i f(E, E_i). \quad (2)$$

如果欲测的某一元素的脉冲幅度为  $E_k$ ，则峰值(或曲线的高度)为

$$g(E_k) = \sum_{i=1}^n a_i f(E_k, E_i). \quad (3)$$

公式(3)表明：在某一能量区间内，强度的大小不仅取决于欲测对象的强度和含量，而且也取决于其它 $\gamma$  放射体的强度和含量。 $g(E_k)$  可直接测出，用单位时间的计数表示。 $f(E_k, E_i)$  均可用标准源确定。这样，(3)式中的  $a_i$  便可计算出来。

在分析铀、镭、钍三组分样品时，公式(3)展开为：

$$\left. \begin{array}{l} g_U/p = a_{11}U + a_{12}Ra + a_{13}Th, \\ g_{Ra}/p = a_{21}U + a_{22}Ra + a_{23}Th, \\ g_{Th}/p = a_{31}U + a_{32}Ra + a_{33}Th, \end{array} \right\} \quad (4)$$

式中： $U, Ra, Th$  为相应元素的含量，以百分比表示； $a_{11}, a_{12}, a_{13}$  为铀峰的铀、镭、钍的系数，以单位重量单位铀含量的计数率表示； $a_{21}, a_{22}, a_{23}$  和  $a_{31}, a_{32}, a_{33}$  分别为镭和钍峰的铀、镭、钍的系数，单位同上； $p$  为样品重量。

方程组(4)的解为

$$U = \frac{\Delta_U}{\Delta}; \quad Ra = \frac{\Delta_{Ra}}{\Delta}; \quad Th = \frac{\Delta_{Th}}{\Delta}$$

式中：

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_U = \begin{vmatrix} g_U/p & a_{12} & a_{13} \\ g_{Ra}/p & a_{22} & a_{23} \\ g_{Th}/p & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{Ra} = \begin{vmatrix} a_{11} & g_U/p & a_{13} \\ a_{21} & g_{Ra}/p & a_{23} \\ a_{31} & g_{Th}/p & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{Th} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & g_U/p \\ a_{21} & a_{22} & g_{Ra}/p \\ a_{31} & a_{32} & g_{Th}/p \end{vmatrix}.$$

当  $a_{11}:a_{12}:a_{13} \neq a_{21}:a_{22}:a_{23} \neq a_{31}:a_{32}:a_{33}$  时，方程组(4)才有独立的解。为了获得稳定的解，需增大  $a_{11}/a_{11} + a_{12} + a_{13}, a_{22}/a_{21} + a_{22} + a_{23}, a_{33}/a_{31} + a_{32} + a_{33}$  的比值，即在某能量区间内，分辨系数愈大愈好。这与方法的测量条件有密切关系。

### 三、

$\gamma$  谱仪的线性关系、甄别水平的漂移、道宽的稳定性、道宽与甄别水平的关系均是测试过程中的重要参数和影响因素。

SGXA-2型单道谱仪的探测部分是由  $\phi 44 \times 51$  毫米的 NaI(Tl) 晶体和 VMP-11/44 型光电倍加管组成的。ALA100/50型线性振幅高度分析器包括放大和甄别两部分，放大倍数为 10—10000 倍，用分贝表示。甄别水平和道宽分别可由 0—100 伏和 1—50 伏连续调节。谱仪的能量测量范围为 0—5 兆电子伏，能量分辨率为 8% ( $Cs^{137}$ )。

实验表明：在一定的工作电压和放大倍数的条件下，各种能量之间保持着良好的线性关系（图 2）。对于不同放大倍数而言，总的线性关系可表示为

$$Y = NX, \quad (5)$$

式中：Y 为能量；X 为该能量在甄别水平出现的位置； $N = \frac{a}{[1.291]^n}$  为斜率，表示每单位甄别水平所代表的能量。从 -40 分贝算起， $a = 61.5$  千电子伏， $n = 0, 1, 2, \dots$  相应于 -40 分贝，-38 分贝，-36 分贝，……。输出讯号为 100 伏时，线性偏离在  $\pm 1\%$  以内。放大的稳定性在电压变化  $\pm 10\%$  时为 0.1%。

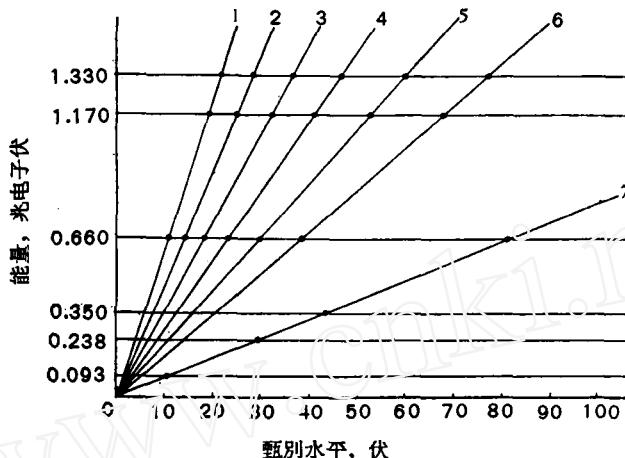


图 2 能量和放大的线型关系

室温 22°C；放射源： $\text{Co}^{60}$ ， $\text{Cs}^{137}$ ，轴-轴-镅平衡和钍粉末标准源。  
 1——-40 分贝；2——-38 分贝；3——-36 分贝；4——-34 分贝；  
 5——-32 分贝；6——-30 分贝；7——-24 分贝。

图 2 中，-24 分贝的能量刻度曲线表明：SGXA-2 型谱仪在低能量区（小于 400 千电子伏）也保持着严格的线性关系。

甄别水平的漂移不仅与分析器放大系数的稳定性和平光倍加管放大漂移有关，而且也与输入脉冲的频率、宽度和幅度有关。实验表明，仪器工作时，周围温度的变化是引起漂移现象的主要因素。外界温度的变化能改变阴极的脱出功，引起阴极电流的变化，产生放大漂移。因此，控制一定的环境温度，充分使阴极与周围达到热平衡，以减弱和防止漂移现象。经长期实验观察，在 8 小时内甄别水平的漂移为 0.25 伏。

道宽的稳定性是确定测量精确度的上限，它主要取决于甄别器的接触电位差。实验指出：道宽的稳定性是良好的，近似于统计误差（见表 3）。

表 3 道宽稳定性实验

| 道宽，千电子伏  | 12   | 16   | 24   | 26    |
|--|------|------|------|-------|
| 相对统计误差 $\sigma = \sqrt{1 + \frac{2Z_p}{Z}} \times 100\%$ | 0.82 | 0.66 | 0.50 | 0.475 |
| 相对误差，%   | 1.20 | 0.57 | 0.76 | 0.20  |

甄別水平与道寬的关系是針對不同脉冲形状而言的。用同一道寬記錄“短尖”峯形的脉冲时,由于該脉冲的延续时间极短,它在低甄別范围内的放大系数大于高甄別范围,故在高甄別水平(90—100 伏)工作时,如果没有相应整形脉冲的设备,将减弱欲测强度的精确度。

上述种种是运用、调节譜仪必需解决的问题,也是着手测量,选择最佳条件的前提。

#### 四、

放大倍数和道寬是应用单道  $\gamma$  閃爍譜仪测定鈾、鑪、鈇含量的主要条件。它们的选择是以計數率、分辨系数、漂移的影响、脉冲形状以及被分析对象的  $\gamma$  譜的特征为基础的。

从测定能量来看,调节放大系数是标志甄別水平能量刻度的改变。正如图 2 所示,随放大倍数的增大,甄別水平每伏代表的能量減低。从 -40 分貝算起,每增大 2 分貝时,能量刻度相应下降 1.291 倍。由于甄別水平和道寬的一致性,故变动放大倍数,实际上相当于改变了每伏道寬所代表的能量。在测量微分譜时,道寬为增量,增量愈小,微分曲綫愈趋于真实,区别曲綫連續峯的可能性愈大。例如,純鈾中  $UX_1$  的  $\gamma$  譜有两个峯( $E = 93$ ,  $E = 64$  千电子伏),如果用大于 30 千电子伏的增量(放大倍数調到甄別水平每伏为 30 千电子伏),那么  $\gamma$  譜的这两个峯就难以区分了。

从确定峯位来看,调节放大倍数可控制能量在甄別水平出現的位置。例如:660 千电子伏( $Cs^{137}$ )的  $\gamma$  峰在放大倍数为 -40 分貝时出現在甄別水平 10.5 伏之上;而在 -24 分貝时,则位于 82 伏左右。由于高、低甄別范围内,尖峯形脉冲的放大不一致,因此,不适于在高甄別水平范围内(80—100 伏)进行测量工作。

依据上述分析,确定测量鈾、鑪、鈇的放大倍数为 630 倍,即 -24 分貝。此时,每伏甄別水平相当于 8 千电子伏。这样的放大倍数不仅能够真实地划出鈾、鑪和鈇的  $\gamma$  譜,而且也使它们在合适的甄別水平上出現。

道寬是微分测量的增量,改变道寬可控制計數率的大小、峯形的变化、漂移的影响程度、分辨系数和本底的作用。鈇峯的道寬实验指出:当道寬增大时(見图 3),峯(1)和谷(2)的計數

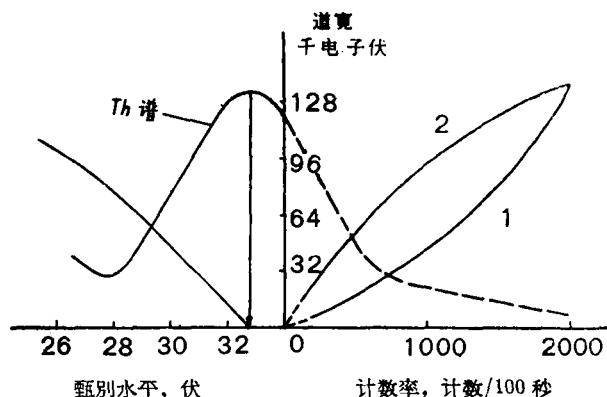


图 3 道寬和計數率、峯位的关系

放大 -24 分貝, 室温 23°C.

$Th$  譜, 其纵坐标为任意单位(计数/100 秒)。

率值按曲线上升。很明显,假若峯形为严格的等边三角形,則計數率值将按線性規律上升。道寬达到某一相当大的值(130 千电子伏)之后,峯和谷均已包括在道寬之内,其計數率值就难以分辨。实际上,这就变成了某一能量区间内(等于該道寬值)的积分测量。这一事实表明,虽然

道宽加大，提高了计数率（提高仪器灵敏度），但峰和谷值的差别却愈来愈小。因此，对单一的峰，应选择计数率既较高而峰谷值之差也较大的道宽，即应选在40—100千电子伏之间。

峰位随道宽的变化而移动。如图3所示，道宽在70千电子伏范围内，峰位按直线关系变化，其角系数为 $45^{\circ}$ 。可见，道宽应选择在70千电子伏以内。

峰的形状也随着道宽的增大而加宽。用峰顶部相当于3%峰高（计数率值）处的宽度( $D$ )与峰所在的甄别水平值( $V$ )的比做参数表示峰形的变化，示于图4之上。峰形愈宽，其顶部计数率值愈接近，因漂移引起的误差愈小（见图5）。图5表明：当漂移一定（ $\pm 0.25$ 伏，或 $\pm 1$ 伏）时，道宽愈大，计数率的相对误差愈小。对于0.25伏的漂移，只要道宽大于8千电子伏，计数率的相对误差均小于3%。

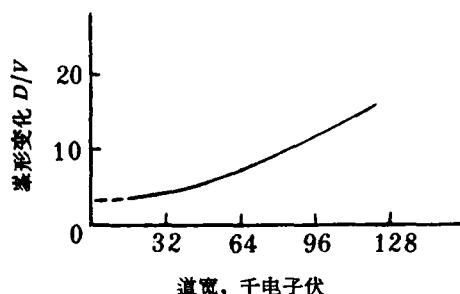


图4 道宽与峰形变化关系  
实验条件同图3。

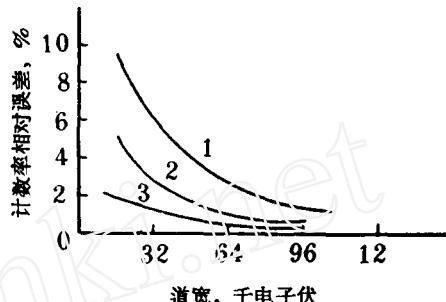


图5 道宽和漂移的关系  
实验条件同图3。

1—— $\pm 1$ 伏；2—— $\pm 0.5$ 伏；3—— $\pm 0.25$ 伏。

观察漂移的实验表明：在一定的放大倍数情况下，同一道宽测量各能量所产生漂移的百分数相同。能量小者，漂移也小。能量大者，漂移也大。为此，测量大能量时道宽也应该大，以减弱漂移的影响程度。

在连续峰的 $\gamma$ 谱和多种相同能量的 $\gamma$ 谱的测量中，道宽愈大，相邻谱线和其他有相同能量的谱线的作用就愈大。为了减小相邻谱线的影响和增大分辨系数，在 $\gamma$ 射线的复合能量测定中，道宽不宜选的过大。

增大道宽能引起本底的增高，不利于低计数的测量。

综上所述，测量单一能量的光电峰时道宽应大些，而测定复合能量的 $\gamma$ 谱时，道宽小些有利。基于上述种种分析，测量铀、镭、钍含量所采用的道宽为：铀——12千电子伏，镭——31.5千电子伏和钍——25.6千电子伏。

## 五、

### 1. 方程式与系数

在用方程组(4)计算铀、镭、钍含量之前，应先求出相应的系数。由于使用仪器不同、测量的几何条件的差别以及标准源的大小等原因，这些系数也不同。借助于纯铀、铀镭平衡和纯钍的标准源，经多次反复测量，各系数值如下[以单位含量铀(1%)、镭( $3.4 \times 10^{-9}$ 克/克)和钍(1%)在100秒内的计数表示]：

$$\begin{aligned} a_{11} &= 194; & a_{12} &= 306.7; & a_{13} &= 225; \\ a_{21} &= 26; & a_{22} &= 768; & a_{23} &= 178; \\ a_{31} &= 37; & a_{32} &= 462; & a_{33} &= 575. \end{aligned}$$

其分辨系数如下：

$$\frac{a_{11}}{a_{11} + a_{12} + a_{13}} = 0.268; \quad \frac{a_{22}}{a_{21} + a_{22} + a_{23}} = 0.79; \quad \frac{a_{33}}{a_{31} + a_{32} + a_{33}} = 0.535.$$

铀、镭和钍的含量公式为

$$\left. \begin{aligned} U &= 0.5663g_U/p - 0.115g_{Ra}/p - 0.186g_{Th}/p, \\ Ra &= 0.164g_{Ra}/p - 0.0133g_U/p - 0.0456g_{Th}/p, \\ Th &= 0.2225g_{Th}/p - 0.1243g_{Ra}/p - 0.0258g_U/p. \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

## 2. 样品的测量步骤及其结果

样品(标准源亦同)重量5克，放置于塑料制的测量盘之中，样品的厚度5毫米，距离晶体10毫米。样品是在铅室内测量的。

测量条件如下：光电倍加管的工作电压935伏；放大倍数—24分贝；测量时间30—50分钟。

铀(UX<sub>1</sub>:93千电子伏，道宽12千电子伏)的甄别水平放在13.8伏，道宽1.5伏，本底为13.5计数/100秒。

镭(RaB:350千电子伏，道宽31.5千电子伏)的甄别水平放在45.2伏，道宽4伏，本底为31.5计数/100秒。

钍(ThB:238千电子伏，道宽25.6千电子伏)甄别水平放在31.2伏，道宽3.25伏，本底为41计数/100秒。

在上述条件下，所测得的g<sub>U</sub>，g<sub>Ra</sub>，g<sub>Th</sub>(每100秒的计数)用本底和重量校正<sup>1)</sup>后，代入公式(6)，可分别求出样品中铀、镭、钍的含量。表4中样品编号1, 2, 3是人工混合矿样。g<sub>U</sub>，g<sub>Ra</sub>，g<sub>Th</sub>是10次结果的平均值，每次计数时间50分。

表4  $\gamma$  谱法分析结果

| 样品编号 | 已知含量  |                          |        | $\gamma$ 谱法分析结果 |                          |       | 备注   |
|------|-------|--------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-------|--|
|      | U, %  | Ra, $\times 10^{-8}$ 克/克 | Th, %  | U, %            | Ra, $\times 10^{-8}$ 克/克 | Th, % |  |
| 1    | 0.389 | 0.644                    | 0.0544 | 0.372           | 0.625                    | 0.051 | 人工混合样品比例如下：<br>1) U + Ra + Th = 2 + 2 + 1,<br>2) U + Ra + Th = 1 + 2 + 2,<br>3) U + Ra + Th = 2 + 1 + 2.<br>样品重量均为5克 |
| 2    | 0.287 | 0.644                    | 0.1088 | 0.273           | 0.643                    | 0.093 |  |
| 3    | 0.311 | 0.322                    | 0.1088 | 0.285           | 0.329                    | 0.095 |  |
| 4    | 0.440 | 1.67                     |        | 0.444           | 1.56                     | 0.014 |  |
| 5    | 0.452 | 1.64                     | —      | 0.458           | 1.66                     | —     |  |
| 6    | 0.570 | —                        | —      | 0.576           | —                        | —     |  |

从测量结果和已知含量的对比看出，相对误差在含量大于0.01%，样品重量为5克时，不超过±10%。

## 3. 誤 差

$\gamma$  谱法中产生误差的来源很多，除了不合规格的标准源能造成测量结果的系统误差和统计涨落等一般性的误差以外，这里主要讨论 $\gamma$ 谱仪本身在测量过程中所带来的几种误差。

脉冲放大漂移能造成光电峰位的偏离。实验表明，0.2伏的漂移在8—36千电子伏道宽

1) 样品和标准源重量相同时，不需要进行重量校正。本工作中在进行样品和标准源的测量时，取用了相同的重量。

内所产生的计数率的相对误差为1—2%。为了确定漂移大小，测量前后必需标定甄别水平的能量刻度。

道宽稳定度的大小可造成光电峰值(计数率值)的改变。实验表明：上述因素所引起的误差在统计误差范围之内。对于含量为 $n \times 10^{-3}$ — $n \times 10^{-4}$ 克/克的样品，50分钟测量可使统计误差降至±2.5%以下。

光电倍加管由于地磁的作用能产生严重的偏差，不仅峰位可以漂动，而且计数率值也跟着变化。因此，在长期的测量过程中，光电倍加管的方位不宜移动。

#### 4. 有待研究的因素

样品中平均原子序数和密度对测量低能 $\gamma$ 射线的影响程度是值得进一步探讨的。雅库鲍维奇<sup>[5]</sup>认为，原子序数的大小和密度的变化实际上不影响测量结果。也有作者持相反意见。这一因素究竟能产生多大误差有待查明和确定。

样品的几何形状、厚度和自吸收，重量校正的范围等都有待研究和改进。

样品中铀镭钍比值的变化范围也是影响精确度的原因之一。 $\gamma$ 谱法适用多大铀镭钍比值是需要进一步阐明的。

提高方法的灵敏度是急待解决的问题。这里，增大立体角度(用凹型晶体)，降低本底，改进电子学线路等等都是进一步完善 $\gamma$ 谱法的重要措施。

#### 结 語

我们应用 $\gamma$ 谱法通过低能 $\gamma$ 谱的微分计数分别测定了铀、镭、钍的含量。铀、镭、钍的光电峰和道宽分别取为： $UX_1$ —93千电子伏，道宽12千电子伏； $RaB$ —350千电子伏，道宽31.5千电子伏和 $ThB$ —238千电子伏，道宽25.6千电子伏。在上述条件下，对重量为5克，待测元素含量大于 $10^{-4}$ 克/克的样品进行测定时，方法的精确度在±10%以内。

研究能谱仪的性能、讨论仪器各变量在具体测量过程中的作用和确定最佳测试条件是分析工作的重要步骤，是提高 $\gamma$ 谱法灵敏度和精确度的重要途径之一。

用 $\gamma$ 谱法测定放射性元素的含量，一方面向电子学仪器提出了严格的要求，另一方面应取得更简宜的流程、更经济的方法和更可靠的数据。为此，从方法的理论到实际的测量，该法都还有待进一步的完善化。

#### 参 考 文 献

- [1] P. M. Hurey, *Bull. G. S. A.*, **67**, No. 6 (1956).
- [2] С. В. Иохельсон, Е. В. Шитов, *Изв. АН СССР сер. геофизич.*, № 1, 98 (1959).
- [3] L. M. John, *Geophysics*, **25**, No. 5, 1054 (1960).
- [4] P. W. Lange, *Analytical Chemistry*, **32**, No. 8, 1013 (1960).
- [5] А. Л. Якубович, Е. И. Зайцев, *Разведка и охрана недр.*, № 2, 33 (1961).
- [6] В. Л. Шашкин, *Методы анализа естественных радиоактивных элементов*, Госатомиздат, 1961.
- [7] Х. Б. Межиборская и др., *Анализ радиометрическая руд  $\beta$ - $\gamma$  методов*, Атомиздат, 1960.
- [8] P. W. Lange, *Analytical Chemistry*, **31**, No. 5, 812 (1959).
- [9] Е. И. Железнова, *Бюл. научно-технич. инф.*, № 7 (1957).
- [10] Е. И. Зайцев, *Бюл. научно-технич. инф.*, № 2 (1958).
- [11] И. Н. Шумилин, *Радиометрические анализы руд и пород по  $\beta$  и  $\gamma$ -лучам с разной степенью фильтраций*, Вопросы рудной радиометрии, Госатомиздат, 1962.
- [12] А. С. Сердюкова, Ю. Т. Капитанов, *Журнал аналитическая химия*, № 1, 88 (1958).
- [13] Б. И. Хазанов, *Атомная энергия*, **14**, № 5, 499 (1963).